

<<单片机应用系统抗干扰技术>>

图书基本信息

书名：<<单片机应用系统抗干扰技术>>

13位ISBN编号：9787810129329

10位ISBN编号：7810129325

出版时间：2001-3-1

出版时间：北京航大

作者：王幸之,王雷,翟成,王闪

字数：634000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<单片机应用系统抗干扰技术>>

内容概要

随着微型计算机的广泛应用，抗干扰技术愈来愈引起人们的重视，并且贯穿于微机测控系统的设计、制造、安装以及运行的各个阶段。

? 全书分12章。

主要包括：可靠性及抗干扰技术的基础知识；常用元器件的选用方法；常用硬件、软件抗干扰原理及方法；微机测控系统中的主机单元、测量单元、D/A及A/D单元、输入/输出单元、键盘/显示单元的配置与抗干扰技术；最后介绍了电源及印制板的抗干扰措施。

? 本书可供大专院校自动化、计算机应用、仪器仪表等有关专业师生，以及从事微机应用系统设计、开发和维修的广大科技人员阅读。

<<单片机应用系统抗干扰技术>>

书籍目录

第一章 可靠性与抗干扰技术概述 1.1 研究抗干扰技术的重要性?? 1.2 可靠性概念?? 一、可靠性定义及定量描述?? 二、系统的可靠性模型?? 1.3 微机测控系统可靠性设计任务与方法?? 一、可靠性设计任务?? 二、可靠性设计一般方法?? 1.4 电磁兼容性设计及常用术语?? 一、电磁兼容性设计及内容?? 二、电磁兼容性标准?? 三、常用名词术语?? 1.5 干扰的分类?? 一、按噪声产生的原因分类?? 二、按噪声传导模式分类?? 三、按噪声波形及性质分类?? 1.6 干扰的耦合方式?? 一、直接耦合方式?? 二、公共阻抗耦合方式?? 三、电容耦合方式?? 四、电磁感应耦合方式?? 五、辐射耦合方式?? 六、漏电耦合方式?? 1.7 单片机测控系统可靠性设计的主要途径??第二章 常用元件可靠性能与选择 2.1 元件的失效特性?? 一、元件的失效规律?? 二、元件的失效形式?? 2.2 元件的失效机理?? 一、温度影响?? 二、湿度影响?? 三、电压影响?? 四、振动、冲击影响?? 2.3 元件的选择与降额设计?? 一、元件的选择准则?? 二、元件的降额设计?? 2.4 电阻器性能比较及应用?? 一、电阻器的噪声与频率特性?? 二、电阻器的选择?? 三、电阻器使用的注意事项?? 四、电阻器的型号命名及标称阻值?? 2.5 电容器特性及应用?? 一、电容器的等效电路?? 二、电容器的种类及选用?? 三、电容器使用注意事项?? 四、电容器的型号及容量表示法??第三章 硬件抗干扰技术原理与方法 第四章 主机单元配置与抗干扰技术 第五章 测量单元配置与抗干扰技术 第六章 D/A、A/D单元配置与抗干扰技术?第七章 数字信号传输通道的抗干扰措施 第八章 功率接口与抗干扰技术 第九章 键盘/显示单元配置与抗干扰技术 第十章 电源的干扰与抑制 第十一章 软件抗干扰原理与方法 第十二章 印刷电路板抗干扰措施 参考文献

<<单片机应用系统抗干扰技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>